VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebier des Patentwesens)

			WIPO	
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwal PAT 01152PCT	WEITERES VORGEH	IEN s	siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/008339	Internationales Anmeldeda 26.07.2004	tum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonat/Jahr) 04.08.2003	
Internationale Patentklassifikation (IPK)	der nationale Klassifikation und	IPK		
G01N21/88, G01N1/28, G06T7/6	o, G06T7/00, H01J37/26, (302B21/00		
A				
Anmelder BASF COATINGS AG et al.				
 Bei diesem Bericht handelt es internationalen vorläufigen Pri Artikel 36 übermittelt wird. 	sich um den internationalen fung beauftragten Behörde r	vorläufigen Prüfungsb lach Artikel 35 erstellt	oericht, der von der mit der wurde und dem Anmelder gemäß	
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 10 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.				
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen				
a. 🗵 (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 3 Blätter; dabei handelt es sich um				
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).				
Blätter, die frühere	Blätter ersetzen, die aher au	ıs den in Feld Nr. 1, F nderung enthalten, die	Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen e über den Offenbarungsgehalt der eg hinausgeht.	
b. (nur an das Internationale Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).				
4. Dieser Bericht enthält Angab	en zu folgenden Punkten:			
☑ Feld Nr. I Grundlage	des Bescheids			
☐ Feld Nr. II Priorität				
Anwendba			e Tätigkeit und gewerbliche	
	Einheitlichkeit der Erfindung			
und der ge	werblichen Anwendbarkeit; U	(2) hinsichtlich der Ne Interlagen und Erklär	euheit, der erfinderischen Tätigkeit ungen zur Stützung dieser Feststellung	
	angeführte Unterlagen			
	Mängel der internationalen A			
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte	Bemerkungen zur internation	nalen Anmeldung		
Datum der Einrelchung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ng dieses Berichts	
11.02.2005		02.08.2005		
Name und Postanschrift der mit der In	ternationalen Prüfung	Bevollmächtigter Bedle	ensteter	
beauftragten Behörde Europäisches Patentan	it			
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx		Duijs, E		
Fax: +49 89 2399 - 446	5	Tel. +49 89 2399-794	5 Oiles on one	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/008339

	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.	
	bei der	ericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
	☐ Ver	rnationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) öffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) rnationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2.	Anmeldear	n der Bestandteile * der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf <i>(Ersatzblätter, die dem</i> mt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als ich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):
	Beschreibu	ing, Selten
	1-25	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ansprüche	, Nr.
	1-16	eingegangen am 02.06.2005 mit Telefax
	☐ einem Sequenzp	sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das rotokoll
3.	☐ Be ☐ An ☐ Ze ☐ Se	und der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: eschreibung: Seite esprüche: Nr. eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : waige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
4.	aufgeliste Auffassun (Regel 70	er Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend ten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach ig der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe .2 c)). eschreibung: Seite insprüche: Nr. eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll (genaue Angaben): waige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):
	* Wenn "ersetz	Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerku t" versehen werden.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/008339

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-16

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-16

Ja: Ansprüche: 1-16

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

PCT/EP2004/008339

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: FORSLIND B: "REPLICATION TECHNIQUES FOR DRY AND WET BIOLOGICAL SURFACES" SCANNING MICROSCOPY, SCANNING MICROSCOPY INTERNATIONAL, Bd. 13, Nr. 1, 1999, Seiten 133-139, XP002306368 CHICAGO, USA
 - D2: AU 17793 95 A (COMMW SCIENT IND RES ORG) 30. November 1995 (1995-11-30).
 - D3: DE 36 36 305 A (L'OREAL) 7. Mai 1987 (1987-05-07)
 - D4: DE 199 05 761 A (SIEMENS AG) 31. August 2000 (2000-08-31)
 - D5: JP 4 127032 A (BABCOCK HITACHI KK), PATENT ABSTRACTS OF JAPAN
 - D6: ECKERT J D: "Replica techniques for the study of fracture surfaces and topography study in general" PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE CARL HANSER VERLAG GERMANY, Bd. 33, Nr. 7, Juli 1996 (1996-07), Seiten 369-372, XP009040217 ISSN: 0032-678X
 - D7: WO 01/53795 A

2. Neuheit (Art. 33(2) PCT) und Erfinderische Tätigkeit (Art. 33(3) PCT)

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der **Ansprüche 1-16** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

2.1 <u>Unabhängiger Verfahrensanspruch 1:</u>

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist **neu** im Sinne von Artikel 33(2) PCT, da keiner der **Dokumente D1-D6** die Kombination aller technischen Merkmale (Merkmale (I)-(III) kombiniert mit (IV) und (v)) des Anspruchs offenbart.

Anspruch 1 kan jedoch nicht als erfinderisch, im Sinne von Artikel 33(3) PCT, gegenüber **D1-D6** betrachtet werden:

- 2.1a D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):
 - -- ein Verfahren zur Charakterisierung von Oberflächenstrukturen (S. 133, "Introduction", erste zwei Zeilen), bei dem man
 - -- (I) mit Hilfe eines chemisch härtbaren Abdruckmaterials von mindestens einer Stelle (I.1) der unbeschädigten Oberfläche eines Gegenstands <u>oder</u> (I.2) der ... geschädigten Oberfläche eines Gegenstands, <u>und/oder</u> (I.3) der ... geschädigten Oberfläche eines auf der Oberfläche des Gegenstands angebrachten Prüfkörpers, einen Abdruck nimmt (S. 133, Zusammenfassung: "silicone mould"; "Introduction", zweiter Absatz: "dental silicone plastics", "the surface to be depicted", "initial fluid character... in the second step it should cure to form a coherent sheet"; S. 134, Fig. 1(b),(c); S. 135, Absatz "The Plastic Impression Technique The method");
 - -- (II) das Abdruckmaterial härtet und so ein Negativ vom Schadensbild erzeugt (S. 133, "Introduction", zweiter Absatz: "negative (or direct)... replica"; S. 134, Fig. 1(d); S. 135, Absatz "The Plastic Impression Technique The method"); und
 - -- (III) den Flächenanteil in % der Oberflächenstrukturen und/oder den Flächenanteil in % der Oberflächenschäden im Schadensbild anhand von lichtmikroskopischen Aufnahmen des Negativs bildanalytisch bestimmt (S. 133, Zusammenfassung: "replication techniques for light... microscopic applications"; S. 135, Absatz "The Plastic Impression Technique The method", erste Zeile; S. 137, Absatz "The mould"; Fig. 2; S. 138, Absatz "Present Status of Replication Techniques", "industrial applications... combination with morphometric systems, image analysis systems or other physical measurement system... quantitative analysis of changes in the surface
 - 2.1b **D2** offenbart <u>ebenfalls</u> (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):
 - -- ein Verfahren zur Charakterisierung von Oberflächenstrukturen (Zusammenfassung: "inspection of... animal's skin"), bei dem man

structures as a result of... the influence of environmental factors").

-- (I) mit Hilfe eines chemisch härtbaren Abdruckmaterials von mindestens einer Stelle (I.1) der unbeschädigten Oberfläche eines Gegenstands <u>oder</u> (I.2) der ... geschädigten Oberfläche eines Gegenstands, <u>und/oder</u> (I.3) der ... geschädigten

Oberfläche eines auf der Oberfläche des Gegenstands angebrachten Prüfkörpers, einen Abdruck nimmt (Anspruch 1 (a) und (b): "selected area", "applying... a settable material... form a detailed impression of the skin"; S. 5, Z. 9-17);

- -- (II) das Abdruckmaterial härtet und so ein Negativ vom Schadensbild erzeugt (Anspruch 1 (b):"applying... a settable material... form a detailed impression of the skin"; S. 5, Z. 9-17; S. 8, Z. 23); und
- -- (III) den Flächenanteil in % der Oberflächenstrukturen <u>und/oder</u> den Flächenanteil in % der Oberflächenschäden im Schadensbild anhand von lichtmikroskopischen Aufnahmen des Negativs bildanalytisch bestimmt (S. 5, Z. 19 S. 6, Z. 14; Fig. 2; S. 9, Z. 8-9).
- 2.1c **D3** offenbart <u>ebenfalls</u> (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):
 - -- ein Verfahren zur Charakterisierung von Oberflächenstrukturen (Titel; Sp. 2, Z. 12-13), bei dem man
 - -- (I) mit Hilfe eines chemisch härtbaren Abdruckmaterials von mindestens einer Stelle (I.1) der unbeschädigten Oberfläche eines Gegenstands <u>oder</u> (I.2) der ... geschädigten Oberfläche eines Gegenstands, <u>und/oder</u> (I.3) der ... geschädigten Oberfläche eines auf der Oberfläche des Gegenstands angebrachten Prüfkörpers, einen Abdruck nimmt (Sp. 2, Z. 22-30);
 - -- (II) das Abdruckmaterial härtet und so ein Negativ vom Schadensbild erzeugt (Sp. 2, Z. 22-30; Sp. 3, Z. 25-27; Sp. 5, Z. 33-36); und
 - -- (III) den Flächenanteil in % der Oberflächenstrukturen <u>und/oder</u> den Flächenanteil in % der Oberflächenschäden im Schadensbild anhand von lichtmikroskopischen Aufnahmen des Negativs bildanalytisch bestimmt (Sp. 2, Z. 57 Sp. 3, Z. 6; Sp. 5, Z. 9-13; Sp. 5, Z. 59-61; Sp. 6, Z. 14-19).
- 2.1d **D4** offenbart <u>ebenfalls</u> (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):
 - -- ein Verfahren zur Charakterisierung von Oberflächenstrukturen (Titel; Sp. 2, Z. 1-2), bei dem man
 - -- (I) mit Hilfe eines chemisch härtbaren Abdruckmaterials von mindestens einer Stelle (I.1) der unbeschädigten Oberfläche eines Gegenstands <u>oder</u> (I.2) der ... geschädigten Oberfläche eines Gegenstands, <u>und/oder</u> (I.3) der ... geschädigten

Oberfläche eines auf der Oberfläche des Gegenstands angebrachten Prüfkörpers, einen Abdruck nimmt (Sp. 1, Z. 67 - Sp. 2, Z. 4; Sp. 2, Z. 32-37);

- -- (II) das Abdruckmaterial härtet und so ein Negativ vom Schadensbild erzeugt (Sp. 2, Z. 37-40); und
- -- (III) den Flächenanteil in % der Oberflächenstrukturen <u>und/oder</u> den Flächenanteil in % der Oberflächenschäden im Schadensbild anhand von lichtmikroskopischen Aufnahmen des Negativs bildanalytisch bestimmt (Sp. 2, Z. 40-43: "untersucht").

Im Stand der Technik (Sp. 1, Z. 13-31) ist die visuelle Beurteilung oder Inspektion nach Merkmal (IV) in Anspruch 1 offenbart.

- 2.1e D5 offenbart ebenfalls (siehe Titel und Zusammenfassung):
 - -- ein Verfahren zur Charakterisierung von Oberflächenstrukturen ("cracking"), bei dem man
 - -- (I) mit Hilfe eines chemisch härtbaren Abdruckmaterials von mindestens einer Stelle (I.1) der unbeschädigten Oberfläche eines Gegenstands <u>oder</u> (I.2) der ... geschädigten Oberfläche eines Gegenstands, <u>und/oder</u> (I.3) der ... geschädigten Oberfläche eines auf der Oberfläche des Gegenstands angebrachten Prüfkörpers, einen Abdruck nimmt;
 - -- (II) das Abdruckmaterial härtet ("polymer film... to harden") und so ein Negativ ("replica") vom Schadensbild erzeugt; und
 - -- (III) den Flächenanteil in % der Oberflächenstrukturen <u>und/oder</u> den Flächenanteil in % der Oberflächenschäden im Schadensbild anhand von lichtmikroskopischen Aufnahmen des Negativs bildanalytisch bestimmt ("obserted with an optical type metal microscope").
- 2.1f D6 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):
 - -- ein Verfahren zur Charakterisierung von Oberflächenstrukturen (Titel), bei dem man
 - -- (I) mit Hilfe eines chemisch härtbaren Abdruckmaterials von mindestens einer Stelle (I.1) der unbeschädigten Oberfläche eines Gegenstands <u>oder</u> (I.2) der ... geschädigten Oberfläche eines Gegenstands, <u>und/oder</u> (I.3) der ... geschädigten Oberfläche eines auf der Oberfläche des Gegenstands angebrachten Prüfkörpers, einen Abdruck nimmt (S. 370-371, Absatz "Replikationsverfahren mit

Silikonkautschuk": "leicht giessbare Material... härtet bei Raumtemperatur", "interessierenden Oberflächenbereich aufgetragen");

- -- (II) das Abdruckmaterial härtet und so ein Negativ vom Schadensbild erzeugt (S. 371, Absatz "Replikationsverfahren mit Silikonkautschuk": "leicht giessbare Material... härtet bei Raumtemperatur", "Aushärtung... danach kann der Negativabdruck von der Probenoberfläche genommen werden"); und
- -- (III) den Flächenanteil in % der Oberflächenstrukturen <u>und/oder</u> den Flächenanteil in % der Oberflächenschäden im Schadensbild anhand von **mikroskopischen** Aufnahmen des Negativs bildanalytisch bestimmt.
- 2.1g Der Gegenstand des Anspruchs 1 **unterscheidet** sich von **D1-D5** dadurch, dass zu den Merkmalen (I)-(III) ebenfalls:
 - -- (IV) die Oberflächenstrukturen und/oder die Oberflächenschäden visuell berurteilt und benotet; und
 - -- (V) den bildanalytisch bestimmten Flächenanteil in % der Oberflächenstrukturen und/oder Oberflächenschäden mit den visuell ermittelten Noten korreliert werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D6 zusätzlich dadurch, -- dass im Schritt (III) ein Lichtmikroskop verwendet wird.

Anspruch ist damit neu (Art. 33(2) PCT) .

- 2.1h Die Verwendung eines einfachen **Licht**mikroskops an Stelle eines hochauflösenden REMs kann jedoch nicht als erfinderisch betrachtet werden. Es handelt sich dabei nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen.
- 2.1i Visuelle Beurteilungen oder Inspektionen nach Merkmal (IV) in Anspruch 1 sind an sich allgemein bekannt. Zumindest in **D4** (Sp. 1, Z. 13-31) wird von dieser mit bestimmten Nachteilen (Auflösung, Systematik, Aufwand) verbundene Technik ausgegangen. In **D4** (oder auch **D1, D2, D3, D5 und D6**) wird ein besseres Verfahren nach Merkmal (I)-(III) in Anspruch 1 vorgeschlagen (siehe oben).

Selbstverständlich würde ein Fachmann, nachdem er die ganze Offenlegungsschrift D4 gelesen hat und/oder ausgehend vom bisherigen visuellen Verfahren vom Stand der Technik, die <u>Eignung bzw. die Gültigkeit</u> eines solchen "angeblich besseren" bildanalytischen Verfahrens für seine Zwecke <u>ermitteln oder überprüfen</u> (technische Aufgabe).

Dies würde er üblicherweise dadurch tun, dass er, zumindest für einen ersten Satz Proben, eine Oberflächenanalyse mittels beider Verfahren durchführt, und dann die Ergebnisse der beiden Analysen miteinander vergleicht, bzw. dann "den bildanalytisch bestimmten Flächenanteil in % der Oberflächenstrukturen und/oder Oberflächenschäden mit den visuell ermittelten Noten korreliert" (Lösung).

Zusätzlich sollte erwähnt werden, dass, ausgehend vom in D1-D6 offenbarten bildanalytischen Verfahren nach Merkmal (I)-(III), ohne Spekulation davon ausgegangen werden kann, dass der Fachmann der die Oberflächenstruktur einer höchstwahrscheinlich geschädigten Probe bildanalytisch bestimmen wird, diese Probe vor oder auch nach der Bildanalyse (z.B. beim Einsetzten in das Lichtmikroskop) ebenfalls visuell betrachten oder bewerten wird. Der Vergleich, oder auch die "Korrelation" nach Merkmal (V), der Bildanalyse nach Merkmal (I)-(III) mit der visuellen Bewertung nach Merkmal (IV) findet somit immer automatisch statt.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann damit nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT):

2.2 Die abhängigen Ansprüche 2-16 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen, siehe die Dokumente D1-D7 und die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen.

Zusätzlich werden die folgenden Hinweise gegeben:

- Anspruch 2: siehe z.B. D1, S. 133, "Introduction", zweiter Absatz, S. 134, Fig. 1(e).
- Anspruch 7: implizit z.B. in D2, S. 7, Z. 20; siehe ebenfalls D7,

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/008339

Zusammenfassung: "Andrückvorrichtung 4".

- Anspruch 8: siehe z.B. D1, S. 133, "Introduction", zweiter Absatz;
- Anspruch 9: siehe z.B. D1,_S. 135, Absatz "The Plastic Impression Technique The method", letzte Zeile;
- Anspruch 14: siehe z.B D1, S. 138, Absatz "Present Status of Replication Techniques": "image analysis systems";
- Anspruch 15: siehe z.B. D3, Sp. 4, Z. 15-22 und Sp. 5, Z. 9-13;
- Anspruch 16: siehe z.B. D1, S. 138, Absatz "Present Status of Replication Techniques": "industrial applications... quantitative analysis of changes in the surface structures as a result of... the influence of environmental factors".

3. Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 33(4) PCT):

Die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands der Ansprüche ist ohne Zweifel (Art. 33(4) PCT).

<u>Zu Punkt VII</u>

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung (Form oder Inhalt)

- 4.1 Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den **Dokumenten D1-D6** offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.
- 4.2 Es handelt sich bei den Wörtern "Rotahub" und "Amtec" auf Seite 4, Zeilen 1 und 3 und "ColorView" auf Seite 14, Zeile 3 und auf Seite 19, Zeile 27 um eingetragene Warenzeichen. Diese als solche gekennzeichnet werden sollen.

35

Internationale Patentanmeldung PCT/EP 2004/008339 PAT 01152 PCT Anlage 1

Neue Patentansprüche 1 bis 16

- Verfahren zur Charakterisierung von Oberflächenstrukturen, bei dem man mit Hilfe eines chemisch härtbaren Abdruckmaterials von mindestens einer **(i)** Stelle der unbeschädigten Oberfläche eines Gegenstandes, (1.1)einer durch mechanische und/oder chemische Einwirkung und/oder 10 (1.2)Einwirkung von Strahlung und/oder Hitze geschädigten Oberfläche eines Gegenstandes und/oder einer durch mechanische und/oder chemische Einwirkung und/oder (1.3)Einwirkung von Strahlung und/oder Hitze geschädigten Oberfläche 15 eines auf der Oberfläche eines Gegenstandes angebrachten Prüfkörpers elnen Abdruck nimmt, 20 das Abdruckmaterial härtet und so ein Negativ vom Schadensbild erzeugt, **(II)** . der Oberflächenstrukturen und/oder Flächenanteil in % (111) Flächenanteil in % der Oberflächenschäden im Schadensbild anhand von lichtmikroskopischen Aufnahmen des Negativs bildanalytisch bestimmt, 25 die Oberflächenschäden visuell die Oberflächenstrukturen und/oder (IV) beurteilt und benotet und der bestimmten Flächenanteil bildanalytisch den . 30 (\mathcal{V}) Oberflächenstrukturen und/oder Oberflächenschäden mit emittelteri Noten korreliert.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man vom Negativ ein Positiv erzeugt.

Internationale Patentanmeldung PCT/EP 2004/098339 PAT 01152 PCT Anlage

2

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass man den Flächenanteil in % der Oberflächenstrukturen und/oder den Flächenanteil in % der Oberflächenschäden im Schadensbild anhand von lichtmikroskopischen Aufnahmen des Positivs bildanalytisch bestimmt.

5

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass man die Oberflächenstrukturen oder das Schadensbild anhand des Positivs durch AFM, "atomic force microscopy", und REM, "Rasterelektronenmikroskopie", ergänzend charakterisiert.

10

- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass man als chemisch härtbares Abdruckmaterial eine olefinisch ungesättigte Doppelbindungen enthaltende Masse verwendet.
- 15 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Masse auf Basis von Silicon verwendet.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass man das chemisch h\u00e4ntbare Abdruckmaterial in der Form einer Scheibe mit Hilfe eines
 Metallstempels auf die Oberfl\u00e4che des Gegenstandes oder des Pr\u00fcfk\u00f6rpers aufpresst, unter dem Metallstempel aush\u00e4rten l\u00e4sst, den Metallstempel von der geh\u00e4rteten Scheibe des Abdruckmaterials entfernt und die geh\u00e4rtete Scheibe des Abdruckmaterials, d. h. das Negativ, von der Oberfl\u00e4che des Gegenstandes oder des Pr\u00fcfk\u00f6rpers abnimmt.

25

Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass man aus dem Negativ ein Positiv erzeugt, indem man das Negativ mit einem flüssigen Kunststoffmaterial in Berührung bringt, wonach man das flüssige Kunststoffmaterial in Kontakt mit dem Negativ verfestigt und das resultierende Positiv vom Negativ entfemt.

30

 Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bls 3 und 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass man das Negativ und das Positiv für die lichtmikroskopischen Aufnahmen mit einem Edelmetall besputtert. Internationale Patentammeldung PCT/EP 2004/008339 PAT 01/52 PCT Anlage

- 3
- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass man für die lichtmikroskopischen Aufnahmen eine hochauflösende Digitalkamera an ein Lichtmikroskop adaptiert.
- 5 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Objektivvergrößerung von 5:1 bis 100:1 verwendet.
 - 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass man Aufnahmen von mindestens zwei Messfeldern macht.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bls 3 und 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Messfeld bei 200 x 100 μm² bis 1.500 x 1.000 μm² liegt.
- 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 13, dadurch
 15 gekennzeichnet, dass man zur Bildaufnahme, Bildanalyse und Bildarchivierung ein Bildverarbeitungsprogramm verwendet.
 - 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass man bei der Bildaufnahme Farbaufnahmen macht.
- 20 16. Verwendung des Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass man das Verfahren bei der Modifizierung, Neuentwicklung und/oder Herstellung von Werkstoffen verwendet.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
 □ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 □ FADED TEXT OR DRAWING
 □ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
 □ SKEWED/SLANTED IMAGES
 □ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
 □ GRAY SCALE DOCUMENTS
 □ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY